



## 检测报告

公司 : N/A  
地址 : N/A  
样品名称 : 集成电路  
型号 : AO3407  
器件品牌 : AOS  
批次代码 : 22±  
器件封装 : SOT-23-3  
样品数量 : 2片  
检测数量 : 2片  
收样日期 : 2023/03/16  
测试日期 : 2023/03/16/15:30 - 2023/03/22/18:10

### 声明:

附件中显示的测试是根据指示步骤进行的,我们对这些测试的准确性和完整性承担全部责任,并保证所有执行测试的人员的资格。

检测 Forever  
报告专用章 审核 Nacy  
批准 Tong

### 注意事项:

1. 报告无审核、批准人签章无效。
2. 报告未盖测试报告章及骑缝章无效。
3. 报告结论只对委托样品负责。
4. 报告未经本实验室书面批准不得部分复制。
5. 报告涂改无效。
6. 如对试验结果有异议,可按申诉程序要求执行。



## 测试项目

- 外观检查
- 电特性测试
- 编程烧录
- 可焊性测试
- X-ray 检测
- ROHS 测试
- 关键功能测试
- 烘烤
- 高温试验
- 低温试验
- 恒温恒湿试验
- 交变湿热试验
- 温度循环试验
- 冷热冲击试验
- 快速温变试验

## 测试方法及测试设备

### 1.1 测试标准:

- AS6081
- GB/T 2423.1-2008
- GB/T 2423.2-2008
- GB/T 2423.3-2016
- GB/T 2423.4-2008
- GB/T 2423.34-2012
- GJB 548B-2005
- GB/T 2423.22-2012



## 1.2 显微镜

- 设备规格:  
光学显微镜: SEZ-260 X7-X45 (设备有效期至: 2023-08-19)  
金相显微镜: FJ-5A X50-X1000 (设备有效期至: 2023-08-19)

## 1.3 数显卡尺

- 设备规格:  
数显卡尺: (0~150) mm (设备有效期至: 2023-08-19)

## 1.4 恒温恒湿箱

- 设备规格:  
恒温恒湿箱: -40°C~150°C (设备有效期至: 2023-08-19)

## 1.5 快速温变箱

- 设备规格:  
快速温变箱: -55°C~125°C, (0~15) K/min (设备有效期至: 2023-08-19)

## 1.6 冷热冲击箱

- 设备规格:  
冷热冲击箱: -65°C~175°C (设备有效期至: 2023-08-19)

## 1.7 功能测试设备

- 设备规格:  
数模混合信号测试机: TR6850 (设备有效期至: 2023-08-19)  
西尔特编程器: 6100N  
半导体管特性图示仪: CA4810A (设备有效期至: 2023-08-19)

## 1.8 检测依据

- 《ON UC2845BD1R2G》:  
<https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20150518/1457707310163.pdf>



## 测试结果

### 外观测试:

依据标准: AS6081

#### 结论描述:

外观检测样品 2 片(#1-#2), 芯片表面丝印清晰完整。均未发现二次涂层、打磨、缺口或破损痕迹, 管脚无异常情况。所测量参数均符合原厂规格书标称范围。

此样品外观检测通过。

#### 规格尺寸:

L: 5.80-6.19 MM

W: 4.81-5.00 MM

H: 1.75 MAX MM

#### 测量尺寸:

L: 6.14 MM

W: 4.92 MM

H: 1.66 MM

### 外观检测结果:

外观标准	是/否	结果
混料	否	通过
正面划痕	否	通过
底部划痕	否	通过
缺口	否	通过
残留	否	通过
压痕	否	通过



# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603

电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230324031
日期:	2023/03/24
页码:	5/23

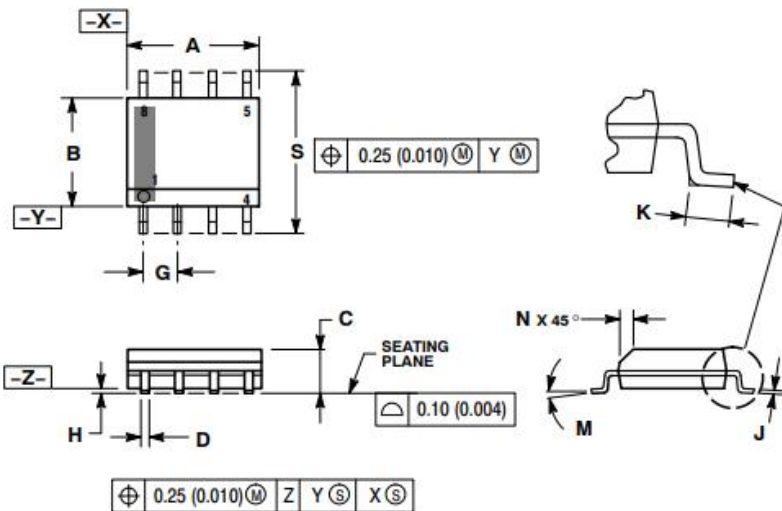
脏污	否	通过
裂痕	否	通过
露铜	否	通过
氧化	否	通过
共面性	是	通过
打磨痕迹	否	通过
二次涂层	否	通过
丙酮测试	N/A	未做测试

## 1. 芯片描述:

UC3844B, UC3845B 系列是高性能的固定频率电流模式控制器。它们专门为离线和 dc - dc 变换器应用而设计, 为设计人员提供了具有最小外部组件的经济有效的解决方案。这些集成电路具有一个振荡器, 一个温度补偿参考, 高增益误差放大器, 电流传感比较器和一个非常适合驱动功率 MOSFET 的大电流图腾柱输出。

## 2. 封装尺寸:

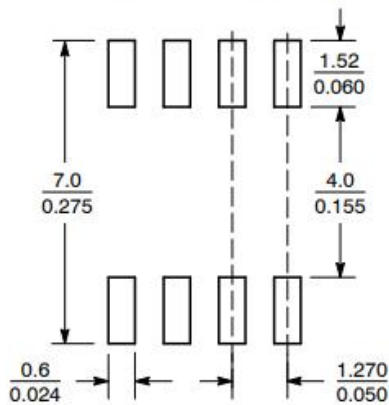
SOIC-8 NB  
CASE 751-07  
ISSUE AK



- NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
  2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
  3. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION.
  4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE.
  5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
  6. 751-01 THRU 751-06 ARE OBSOLETE. NEW STANDARD IS 751-07.

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.80	5.00	0.189	0.197
B	3.80	4.00	0.150	0.157
C	1.35	1.75	0.053	0.069
D	0.33	0.51	0.013	0.020
G	1.27 BSC		0.050 BSC	
H	0.10	0.25	0.004	0.010
J	0.19	0.25	0.007	0.010
K	0.40	1.27	0.016	0.050
M	0°	8°	0°	8°
N	0.25	0.50	0.010	0.020
S	5.80	6.20	0.228	0.244

SOLDERING FOOTPRINT\*



SCALE 6:1 (mm/inches)

\*For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

## 3.来料信息:

重量	3 g	来料数量	2片
箱子数量	N/A	完整标签	不存在
封装类型	卷带	防潮保护	不存在
MSL等级	N/A	ESD保护	存在

备注: 客户提供测试样品 3055 片。

来料图片-1



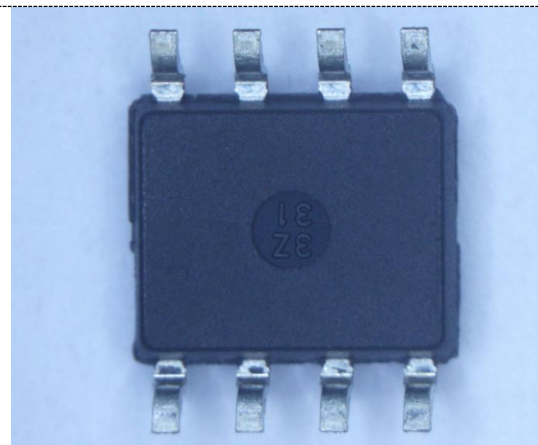
来料图片-2



来料图片-3



来料图片-4



## 4.外观测试:

依据标准: AS6081

检测环境 环境温度: 25.2 °C 相对湿度: 52.3 %RH

外观检测样品 2 片(#1-#2) , 芯片表面丝印清晰完整。均未发现二次涂层、打磨、缺口或破损痕迹, 管脚无异常情况。所测量参数均符合原厂规格书标称范围。

此样品外观检测通过。

规格尺寸:

L: 5.80-6.19 MM

W: 4.81-5.00 MM

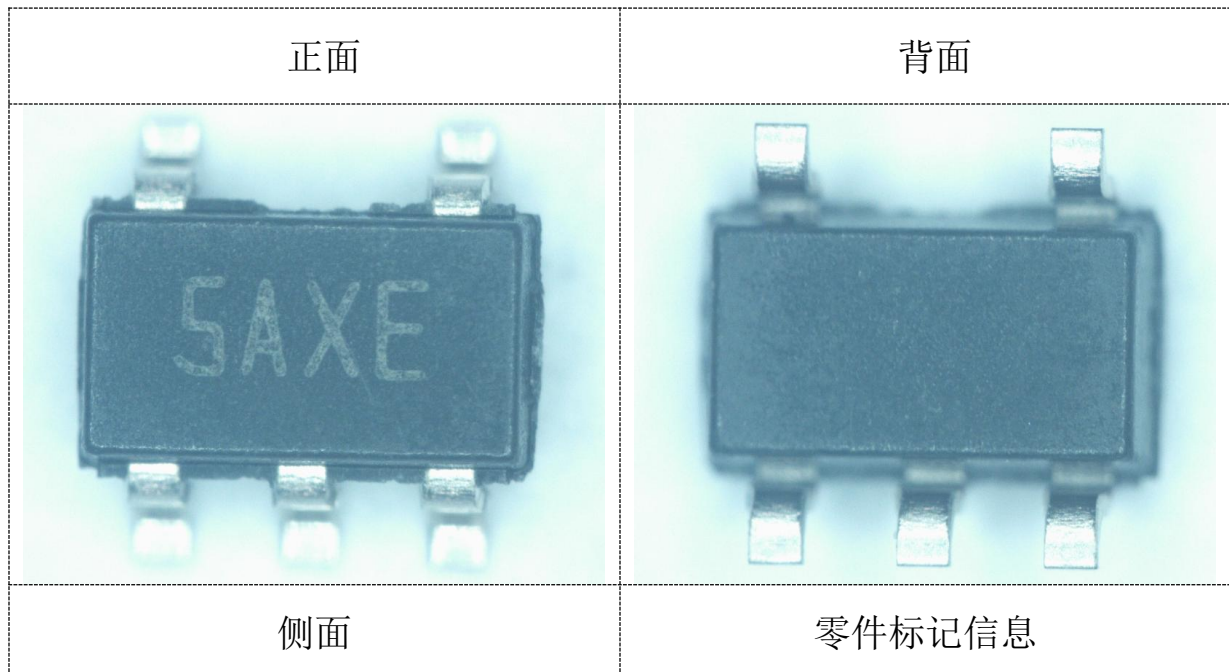
H: 1.75 MAX MM

测量尺寸:

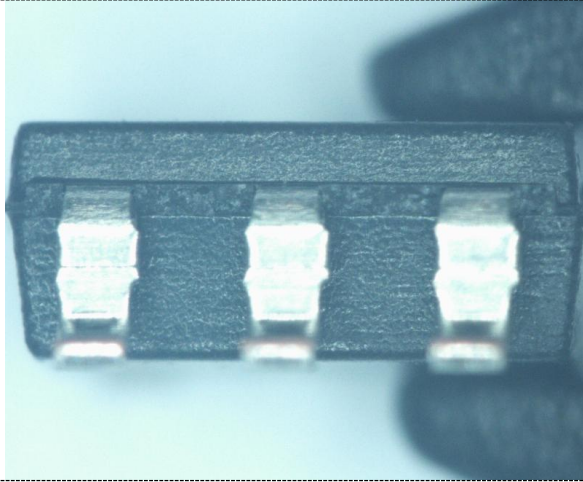
L: 6.14 MM

W: 4.92 MM

H: 1.66 MM







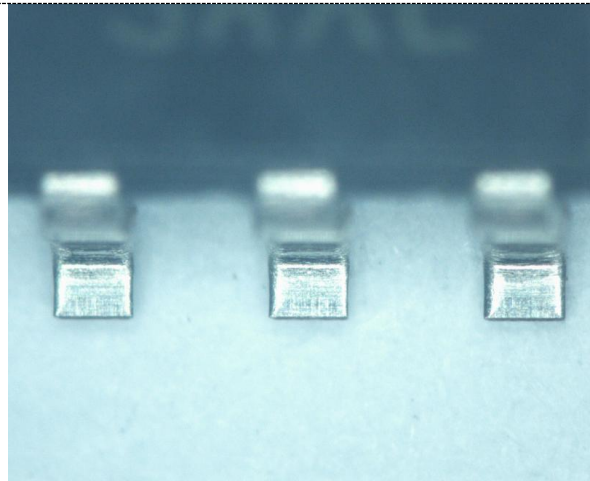
正面丝印

## 5AX or 5AXx

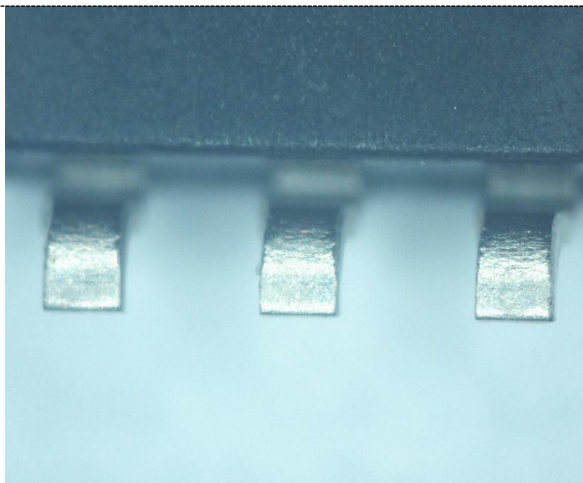
正面管脚



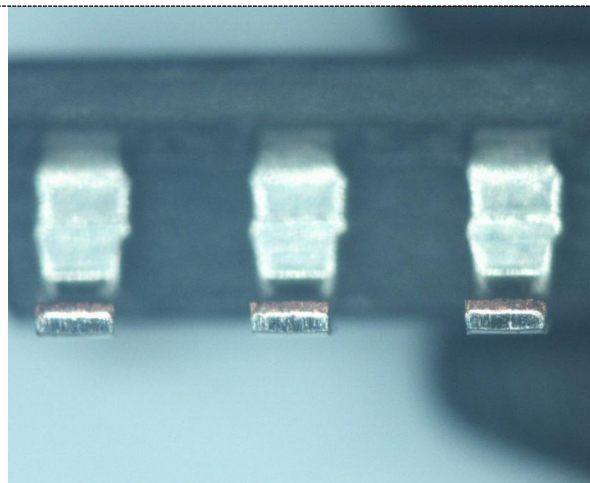
背面管脚



管脚截面



D=2.88 MM



E=2.83 MM

报告编号:	SZ20230324031
日期:	2023/03/24
页码:	10/23



A=1.28 MM



## 5. 关键功能测试:

依据标准: AS6081

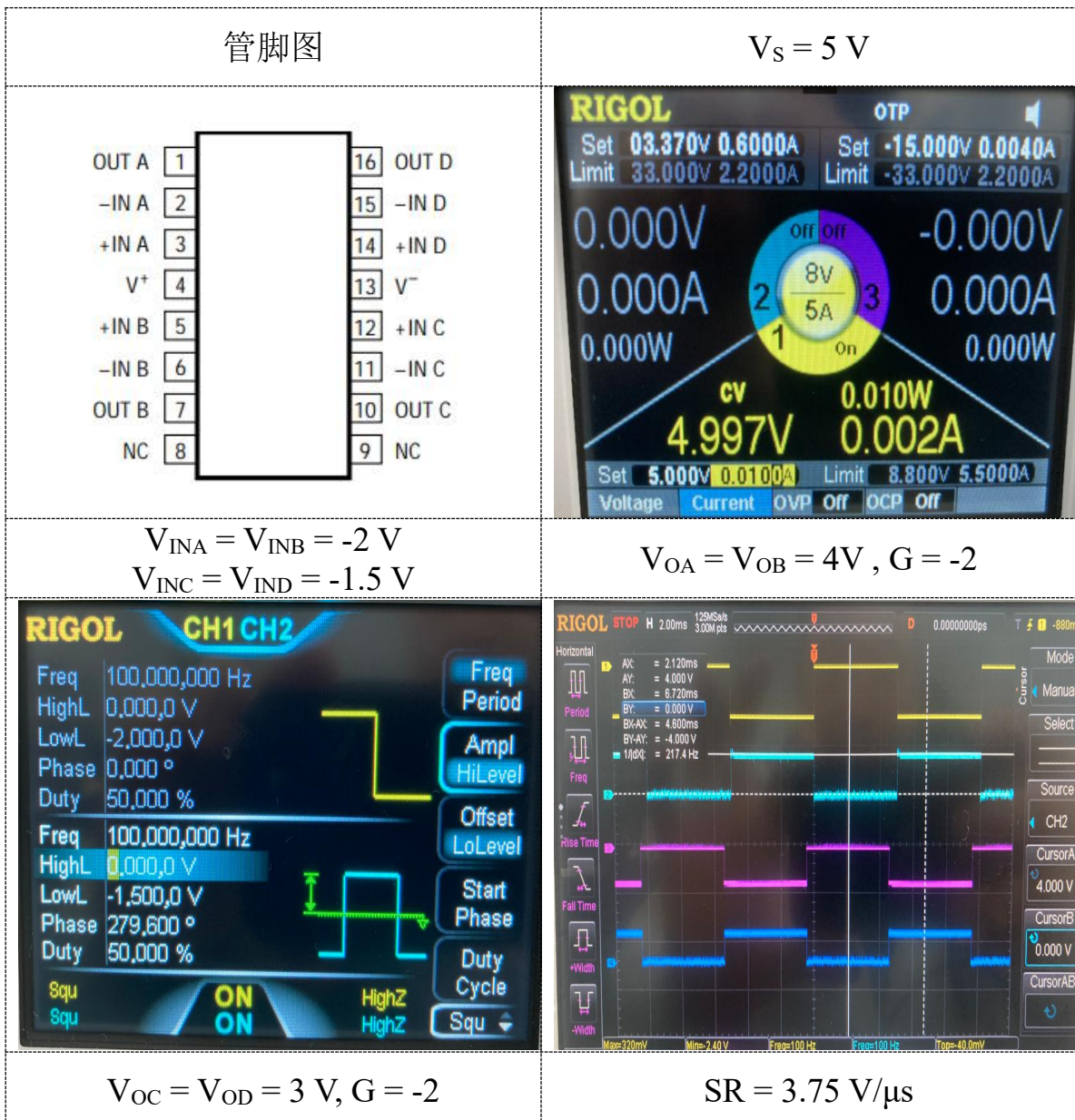
检测环境 环境温度: 25.8 °C 相对湿度: 57.3 % RH

常温初始测量:

使用直流电源、信号发生器和示波器验证以下参数:

放大增益:  $G = -2 @ V_{INA} = V_{INB} = -2 V, V_{INC} = V_{IND} = -1.5 V;$

转换速率:  $SR = 2 V/\mu s TYP @ V_S = 5 V;$





## 关键功能测试结果:

关键功能测试	结果:
测试总量:	3 pcs
通过数量:	3 pcs
失败数量:	0 pcs
结论:	所有样品都通过参数测试。

## 6.高温试验结果:

依据标准: GB/T 2423.2-2008

检测环境 环境温度: 24.5 °C 相对湿度: 50.4% RH

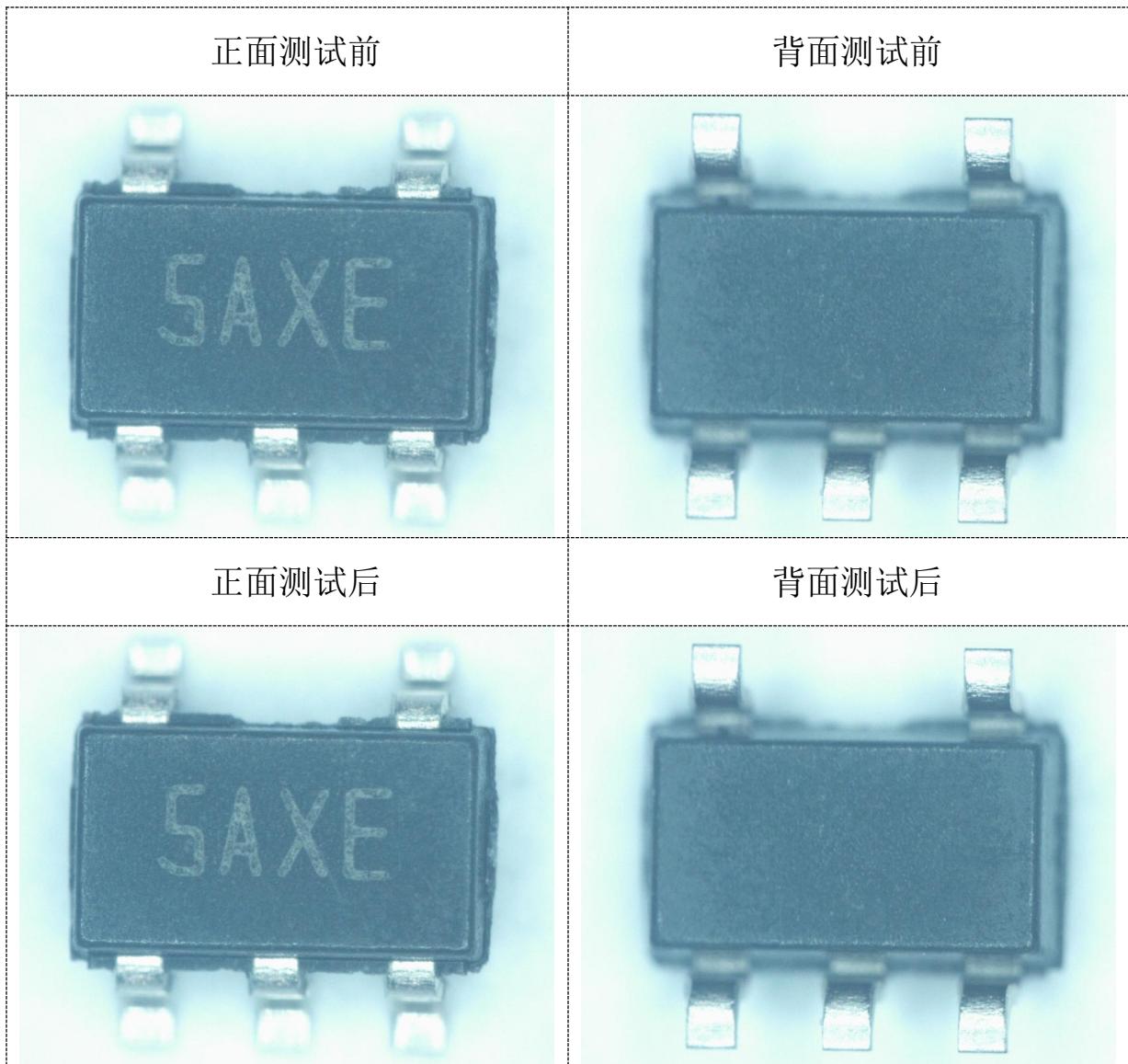
样品数量为3件。待试验箱条件温度斜率为1K/min, 125°C, 72h后, 待试验箱温度达到常温后取出样品, 在实验室环境中恢复2h后检查外观。

测试结果:

样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

样品的型号等标记清晰正确。



## 7.低温试验结果:

依据标准: GB/T 2423.1-2008

检测环境 环境温度: 24.7 °C 相对湿度: 51.6% RH

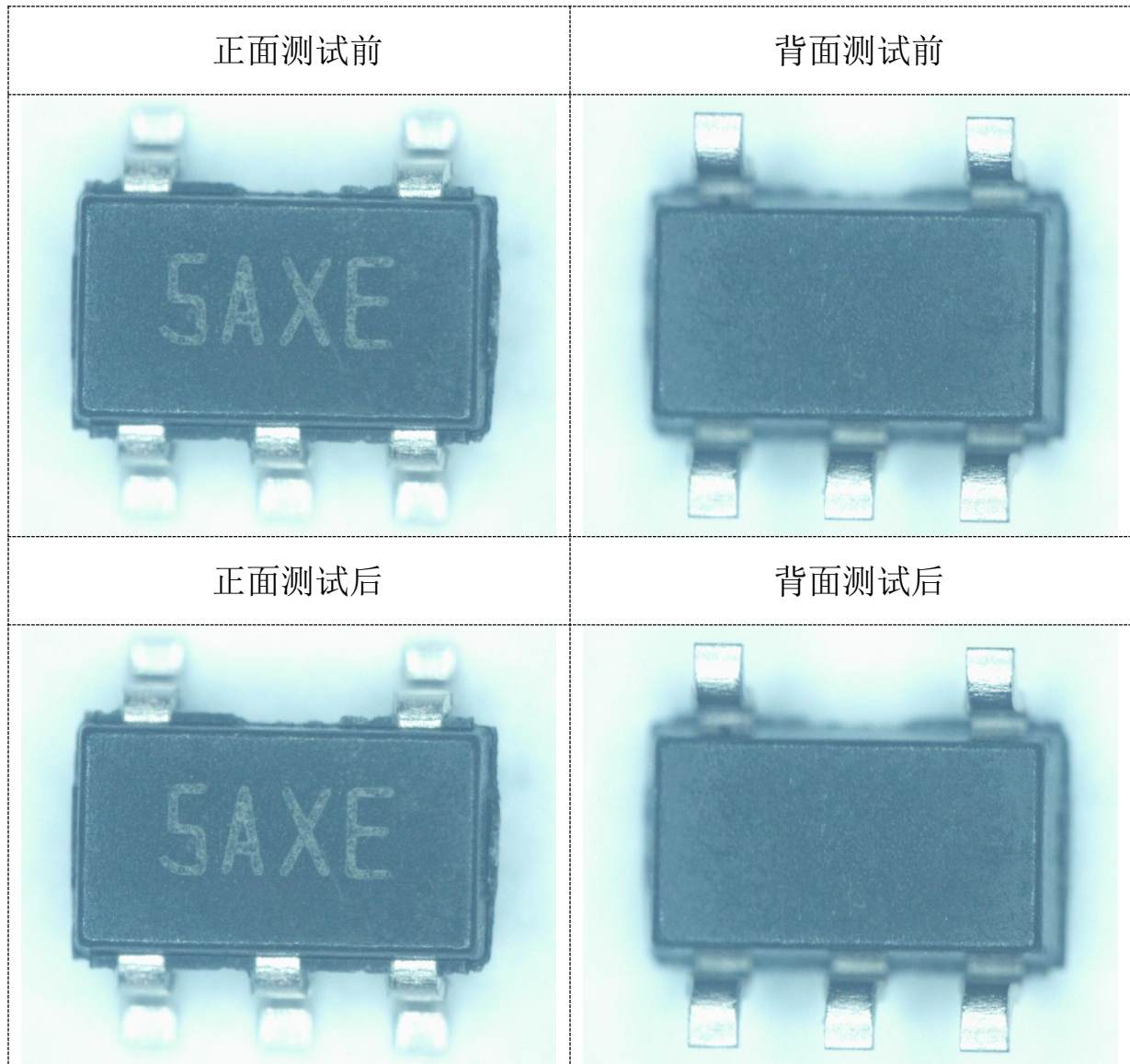
样品数量为3件。待试验箱温度斜率为1K/min, -40°C, 72h后, 待试验箱温度达到常温后取出样品, 在实验室环境中恢复2h后检查外观。

测试结果:

样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

样品的型号等标记清晰正确。



## 8. 恒温恒湿试验结果:

依据标准: GB/T 2423.3-2016

检测环境 环境温度: 24.8 °C 相对湿度: 52.3% RH



# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603

电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230324031
日期:	2023/03/24
页码:	15/23

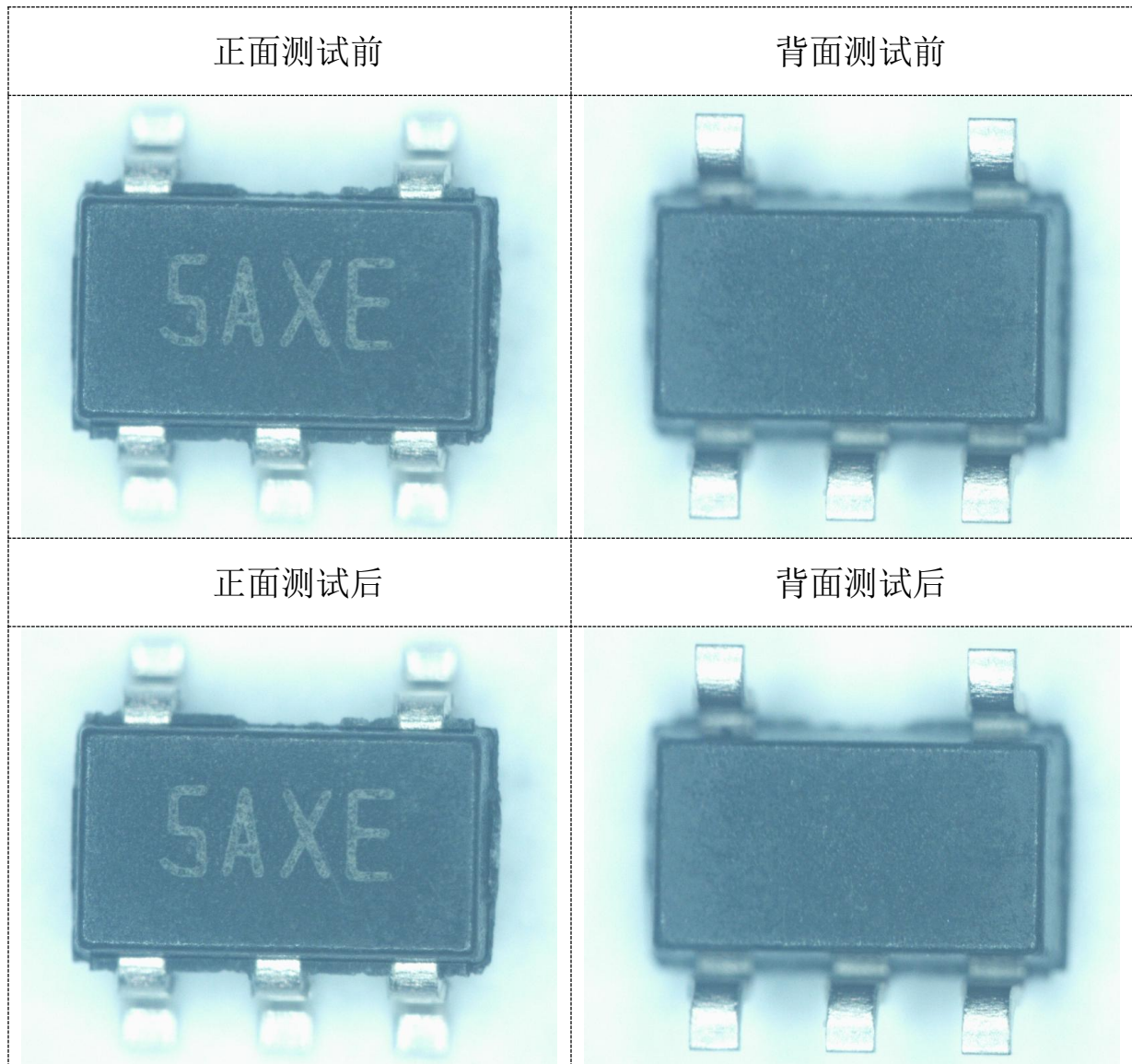
样品数量为3件。样品放入40℃、85%RH的试验箱中。10天后，当试验箱温度达到常温时取出样品，在实验室环境中恢复2h后检查外观。

测试结果:

样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

样品的型号等标记清晰正确。



## 9. 交变湿热试验结果:

依据标准: GB/T 2423.4-2008

检测环境 环境温度: 24.8 °C 相对湿度: 52.3% RH

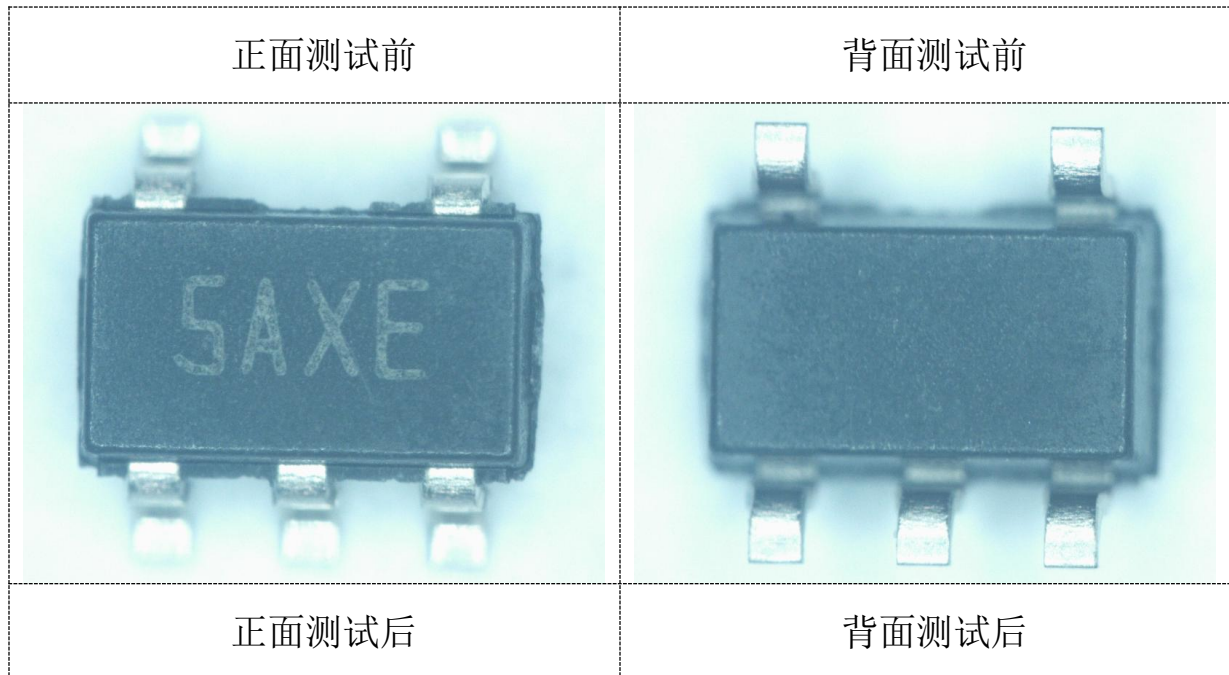
样品数量为3件。在25°C、12h、55°C、12h的试验箱中循环6次后, 在25±3°C下检查外观。

测试结果:

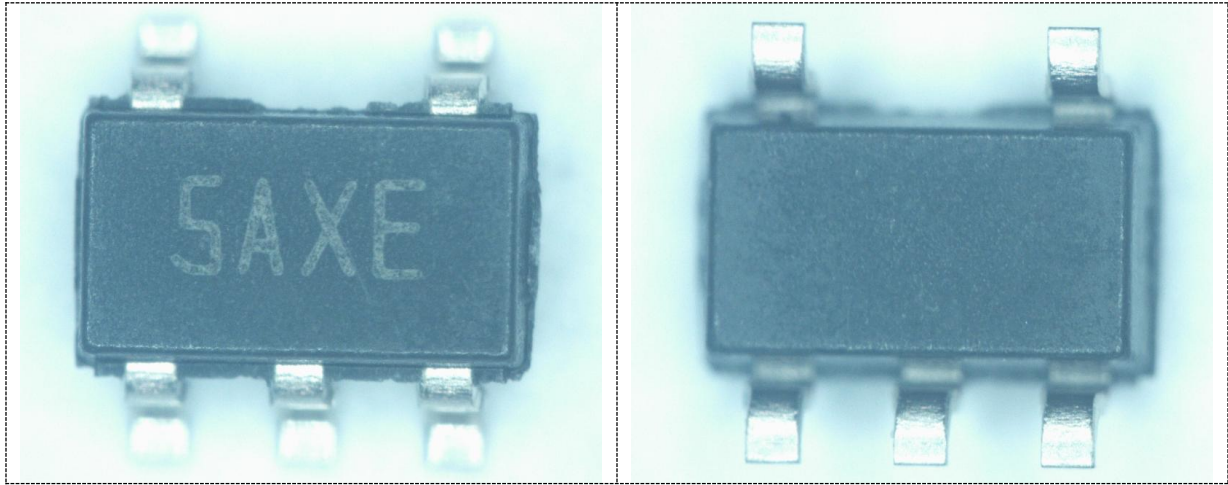
样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

样品的型号等标记清晰正确。







## 10.温度循环试验结果:

依据标准: GB/T 2423.34-2012

检测环境 环境温度: 24.8 °C 相对湿度: 52.3% RH

样品数量为3件, 温湿度程序按标准设定, 使试验箱温度在25°C~65°C~25°C~65°C~25°C~10°C~25°C之间循环10次, 共240h, 检查外观。

测试结果:

样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

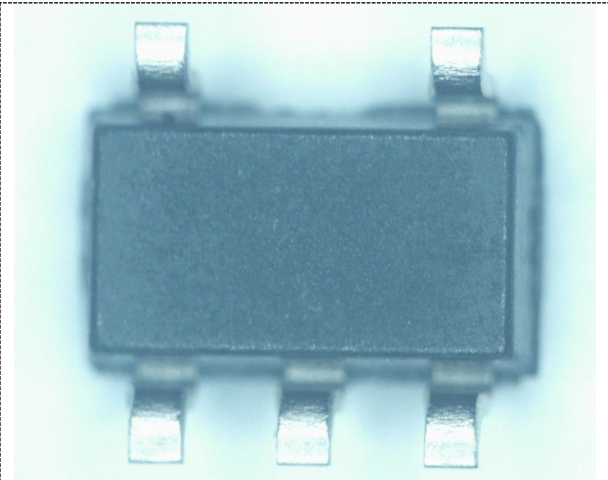
样品的型号等标记清晰正确。

正面测试前

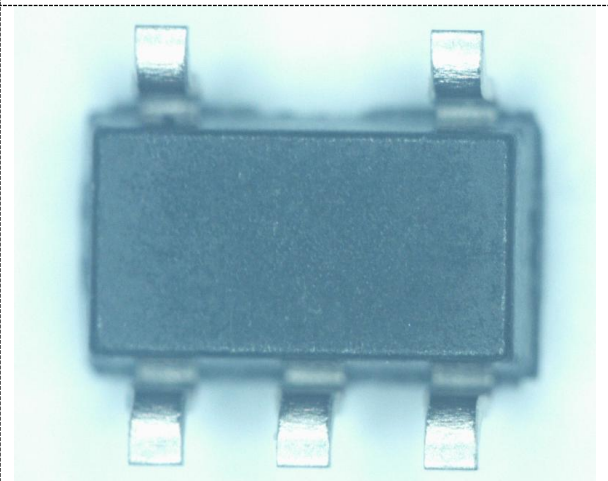
背面测试前



正面测试后



背面测试后



## 11.冷热冲击试验结果:

依据标准: GJB 548B-2005

检测环境 环境温度: 24.4 °C 相对湿度: 52.3% RH

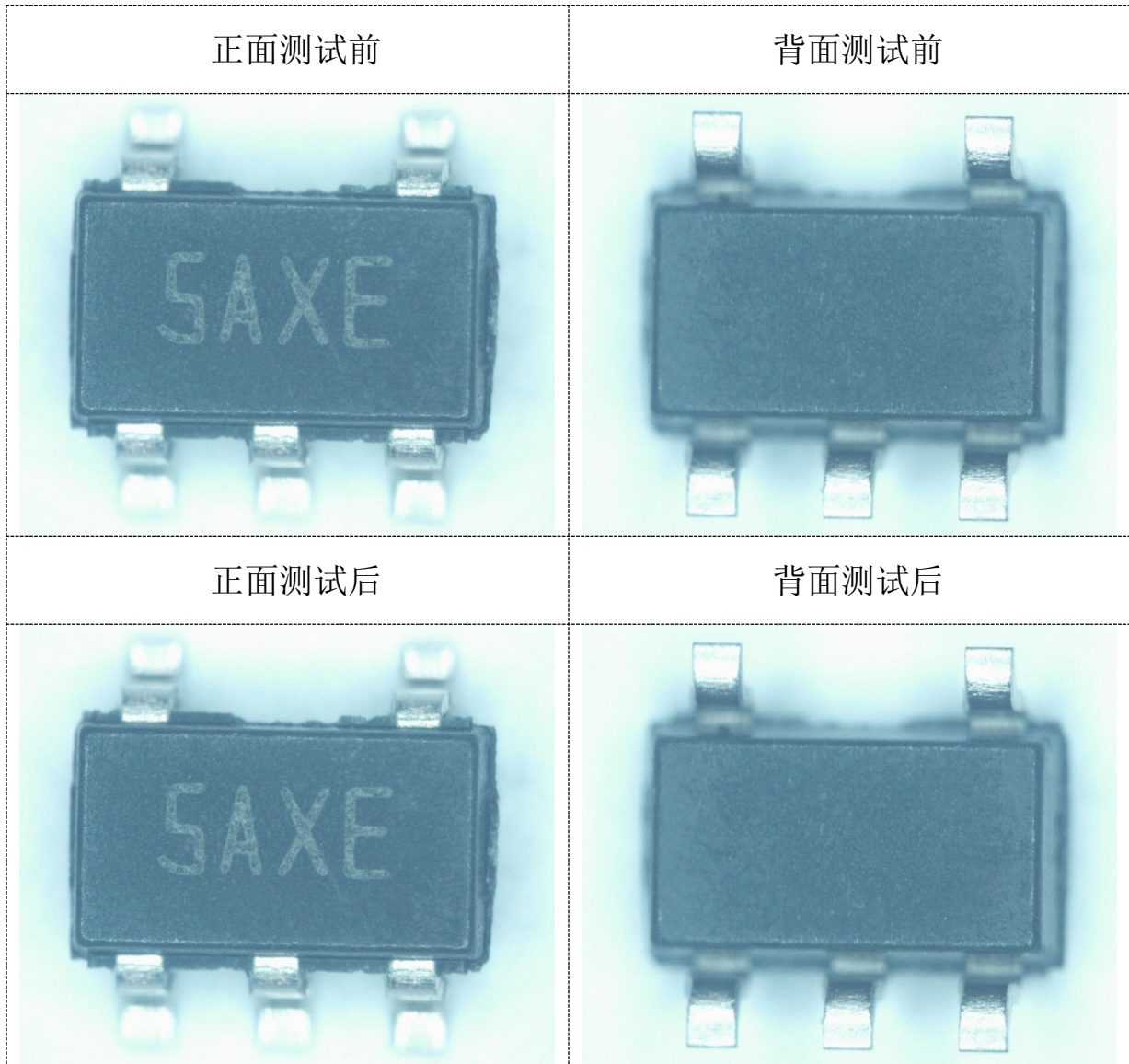
样品数量为3件。试验箱温度为-55°C, 3h, 125°C, 3h, 循环10次, 共60h。待试验箱温度达到常温后, 取出样品, 在实验室环境中恢复2h后检查外观。

测试结果:

样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

样品的型号等标记清晰正确。



## 12.快速温变试验结果:

依据标准: GB/T 2423.22-2012

检测环境 环境温度: 25.0 °C 相对湿度: 53.7% RH

样品数量为3件。试验箱温度斜率为15K/min, -55°C, 3h, 125°C, 3h后, 循环两次。

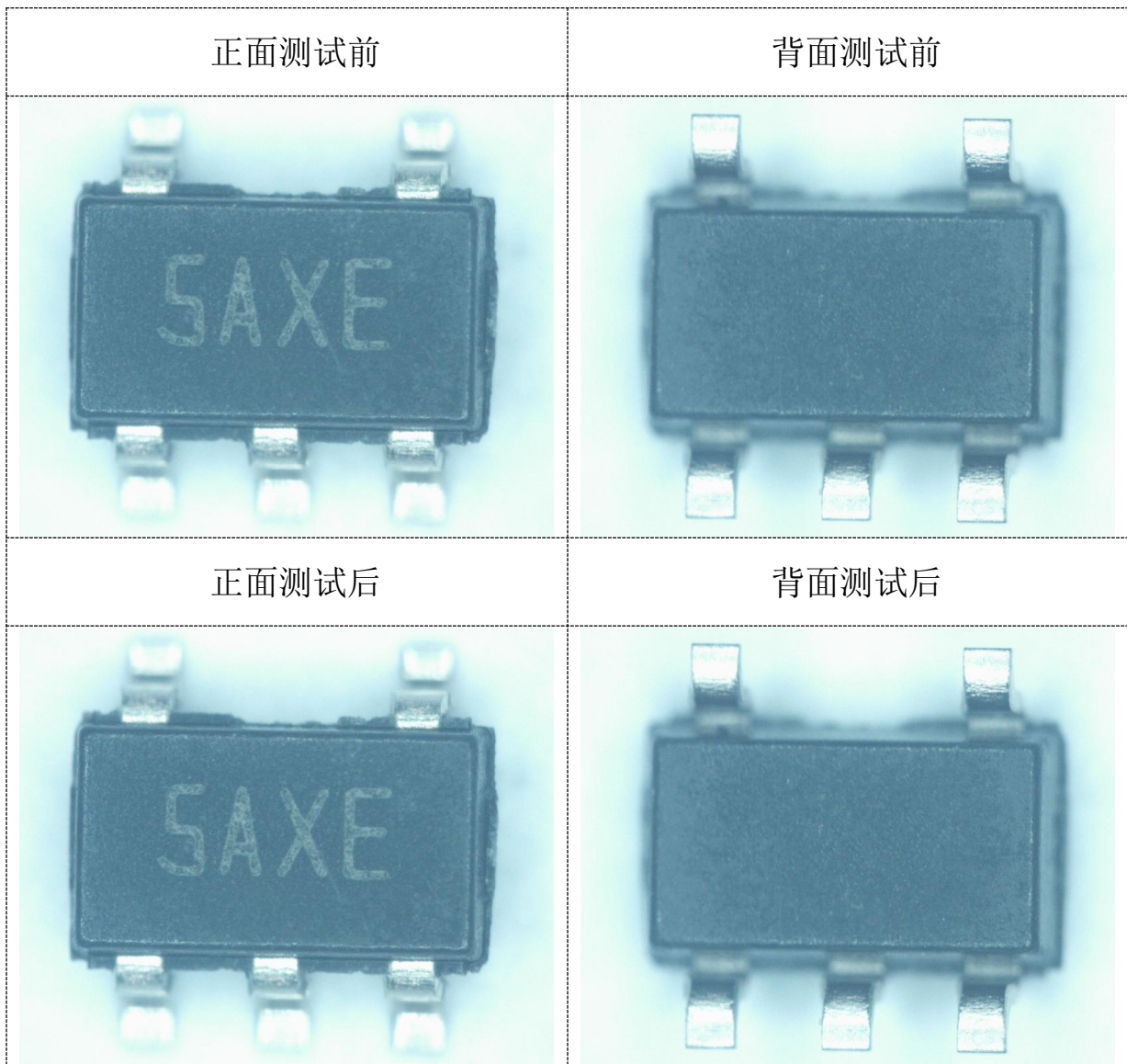
待试验箱温度达到常温后, 取出样品, 在实验室环境中恢复2h后检查外观。

测试结果:

样品表面无污迹、锈迹、涂层起泡、脱落等损伤;

样品壳体变形、断裂、引线无机械损伤、腐蚀等现象;

样品的型号等标记清晰正确。



## 13.关键功能测试:

依据标准: AS6081

检测环境 环境温度: 25.8 °C 相对湿度: 57.3 % RH

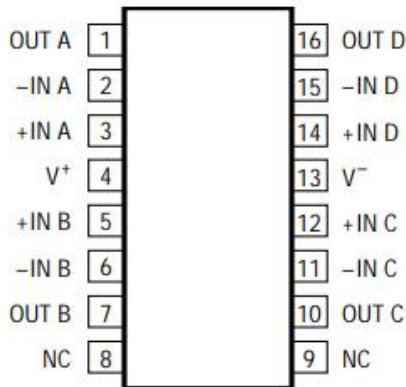
老化后在室温下测试:

使用直流电源、信号发生器和示波器验证以下参数:

放大增益:  $G = -2 @ V_{INA} = V_{INB} = -2\text{ V}, V_{INC} = V_{IND} = -1.5\text{ V};$

转换速率:  $SR = 2\text{ V}/\mu\text{s TYP} @ V_S = 5\text{ V};$

管脚图



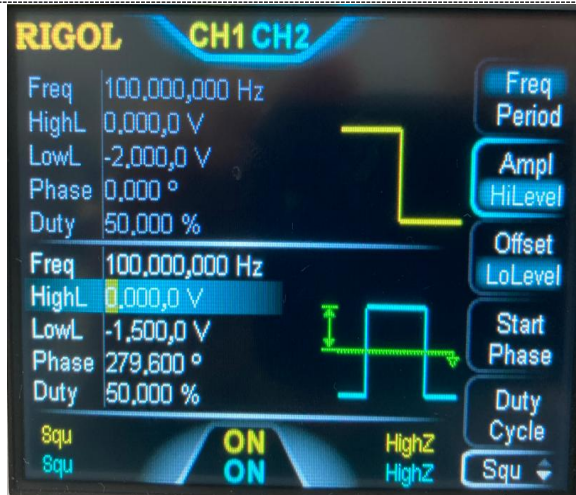
$$V_{INA} = V_{INB} = -2\text{ V}$$

$$V_{INC} = V_{IND} = -1.5\text{ V}$$

$V_S = 5\text{ V}$



$$V_{OA} = V_{OB} = 4\text{ V}, G = -2$$



$$V_{OC} = V_{OD} = 3\text{ V}, G = -2$$



$$SR = 3.75\text{ V}/\mu\text{s}$$



# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603

电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230324031
日期:	2023/03/24
页码:	22/23



## 关键功能测试结果:

关键功能测试	结果:
测试总量:	3 pcs
通过数量:	3 pcs
失败数量:	0 pcs
结论:	所有样品都通过参数测试。

-报告结束-



# 创芯在线电子检测中心

网站: <https://www.iclabcn.com>

地址: 深圳市福田区中航路鼎诚国际大厦2603

电话: 0755-82719442 邮箱: [engineer@iclabcn.com](mailto:engineer@iclabcn.com)



报告编号:	SZ20230324031
日期:	2023/03/24
页码:	23/23

获得更多资讯, 请访问: <https://www.iclabcn.com>

## CXO实验室公众微信号

